

ГОСТ 18986.14—85

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

**МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
И ДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЙ**

Издание официальное

Б3 1—2001

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Методы измерения дифференциального и динамического сопротивлений

**ГОСТ
18986.14—85**

Semiconductor diodes. Methods for measuring differential and slope resistances

**Взамен
ГОСТ 18986.14—75,
ГОСТ 19656.8—74**

МКС 31.080.10
ОКП 62 1000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 мая 1985 г. № 1448 дата введения установлена

01.07.86

Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые диоды и устанавливает следующие методы измерения дифференциального и динамического сопротивлений:

- метод замещения (метод I);
- резонансный метод с параллельным контуром (метод II);
- резонансный метод с последовательным контуром (метод III);
- мостовой метод (метод IV).

Метод I применяют для измерения дифференциального сопротивления на низкой частоте.

Методы II, III, IV применяют для измерения дифференциального сопротивления на высокой частоте, а также для измерения динамического сопротивления, если значение амплитуды измерительного сигнала равно или меньше значения постоянного напряжения.

Стандарт не распространяется на стабилитроны.

Общие условия при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 18986.0—74 и ГОСТ 19656.0—74.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2769—80 в части методов измерения динамического сопротивления (см. приложение 1).

1. МЕТОД ЗАМЕЩЕНИЯ

1.1. Принцип, условия и режим измерения

1.1.1. Метод основан на сравнении дифференциального сопротивления диода с сопротивлением калибровочного резистора.

1.1.2. Измерения проводят в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406—81.

1.1.3. Значения постоянного тока, частоты измерения должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях (далее — ТУ) на диоды конкретных типов.

1.2. Аппаратура

1.2.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт. 1.

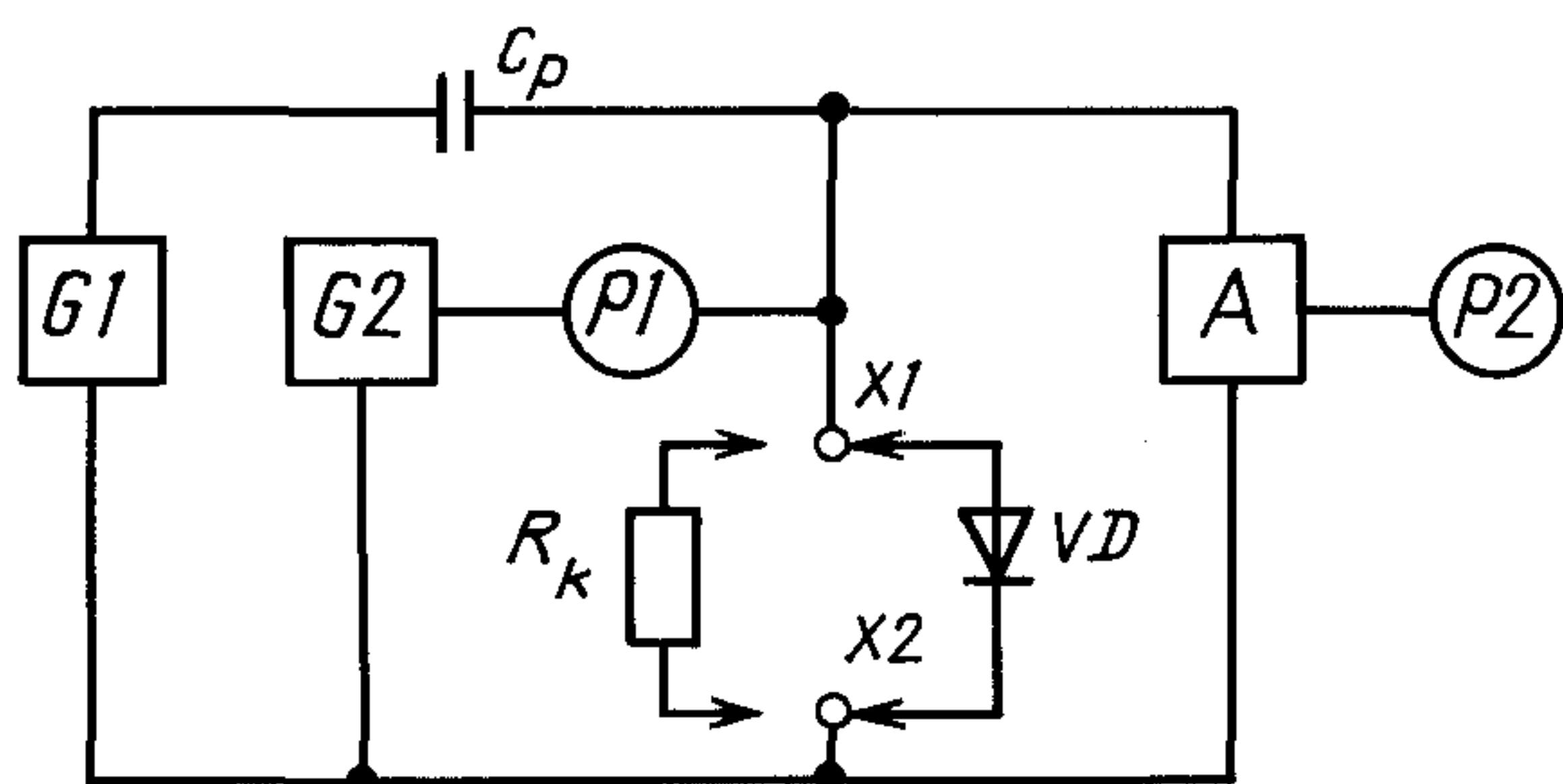
Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Май 2004 г.

С. 2 ГОСТ 18986.14—85



G1 — генератор переменного тока; *G2* — генератор постоянного тока; *C_p* — разделительный конденсатор; *R_k* — калибровочный резистор; *VD* — диод; *X1*, *X2* — контакты для подключения диода (допускается четырехзажимная схема включения); *A* — усилитель; *P1*, *P2* — измерительные приборы

Черт. 1

1.2.2. Генератор переменного тока *G1* должен удовлетворять следующим требованиям:

- амплитуда переменного тока на диоде не должна превышать 10 % значения постоянного тока;
- нестабильность амплитуды не должна выходить за пределы $\pm 1\%$;
- выходное сопротивление генератора *G1* должно не менее чем в 100 раз превышать максимальное значение измеряемого сопротивления диодов;
- частота генератора должна быть фиксированной и выбираться из условий

$$f_{\text{в}} \leq \frac{1,59 \cdot 10^{-3}}{r_{\text{диф. max}} \cdot C_{\text{д}}} \quad \text{или}$$

$$f_{\text{в}} \leq \frac{1,59 \cdot 10^{-3} r_{\text{диф. min}}}{L_{\text{п}}},$$

где *f_в* — верхняя допустимая частота генератора (не ниже 1 кГц), Гц;
r_{диф. max} (*r_{диф. min}*) — максимальное (минимальное) значение дифференциального сопротивления, указанное в стандартах или ТУ на диоды конкретных типов, Ом;
C_д — общая емкость диода, Ф;
L_п — индуктивность диода, Гн.

Конкретные значения *C_д* и *L_п* указывают в стандартах или ТУ на диоды конкретных типов.

1.2.3. Генератор постоянного тока *G2* должен удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать установление и поддержание постоянного тока через диод с погрешностью в пределах $\pm 3\%$;
- нестабильность тока не должна выходить за пределы $\pm 1\%$;
- выходное сопротивление генератора *G2* должно не менее чем в 100 раз превышать значение максимального измеряемого сопротивления;
- коэффициент пульсации не должен выходить за пределы $\pm 1\%$.

1.2.4. Емкость разделительного конденсатора *C_p*, Ф, следует выбирать из условия

$$\frac{1}{2\pi f C_{\text{p}}} \leq \frac{r_{\text{диф}}}{100},$$

где *r_{диф}* — значение дифференциального сопротивления, указанное в стандартах или ТУ на диоды конкретных типов, Ом;

f — частота измерения, Гц.

1.2.5. Значение сопротивления калибровочного резистора должно удовлетворять условию $R_{\text{k}} \approx 0,9r_{\text{диф. max}}$.

Погрешность определения значения сопротивления калибровочного резистора не должна выходить за пределы $\pm 0,5\%$.

Температурный коэффициент сопротивления калибровочного резистора не должен превышать 10^{-3} К^{-1} .

1.2.6. Измерительный прибор *P1* должен обеспечивать измерение постоянного тока через диод с погрешностью в пределах $\pm 2\%$.

В электрической схеме допускается отсутствие прибора *P1*.

1.2.7. Усилитель *A* должен удовлетворять следующим требованиям:

- полное входное сопротивление усилителя должно не менее чем в 100 раз превышать дифференциальное сопротивление диода;

- амплитудная характеристика должна быть линейной с погрешностью в пределах $\pm 3\%$;

- усилитель должен иметь ступенчатое или плавное регулирование коэффициента усиления.

1.2.8. Погрешность измерительного прибора *P*2 не должна выходить за пределы $\pm 2\%$.

1.3. Подготовка и проведение измерений

1.3.1. Рекомендуемая частота измерения 1000 Гц.

1.3.2. Подключают калибровочный резистор *R_k* к контактам *X1* и *X2*. Подают переменный ток от генератора *G1*. По известному значению сопротивления резистора *R_k* калибруют в омах шкалу измерительного прибора *P*2 путем изменения коэффициента усиления усилителя или изменения амплитуды генератора переменного тока *G1*, при этом должны быть выполнены требования к значению амплитуды, изложенные в п. 1.2.2.

1.3.3. Подключают диод к контактам *X1* и *X2*. Устанавливают заданное значение постоянного тока от генератора *G2*.

1.3.4. По измерительному прибору *P*2 отсчитывают значение дифференциального сопротивления диода.

1.4. Показатели точности измерения

1.4.1. Погрешность измерения дифференциального сопротивления не должна выходить за пределы $\pm 7\%$ с доверительной вероятностью 0,997.

1.4.2. Расчет погрешности измерения приведен в приложении 2.

2. РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ

2.1. Принцип, условия и режим измерения

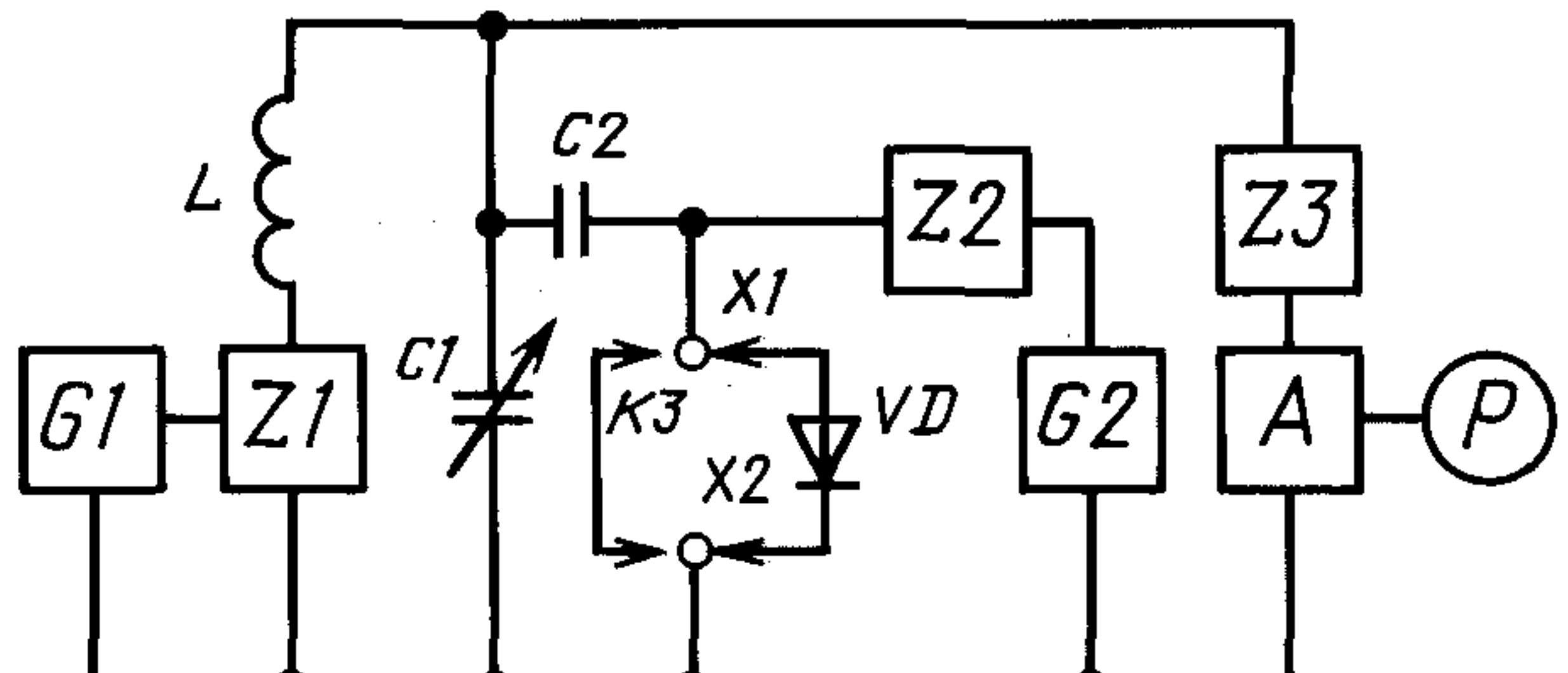
2.1.1. Метод основан на измерении дополнительных потерь, вносимых в параллельный резонансный контур с известной добротностью при подключении к нему диода, через который пропускают прямой постоянный ток заданного значения.

2.1.2. Условия и режим измерения должны соответствовать требованиям, изложенным в пп. 1.1.2 и 1.1.3.

2.2. Аппаратура

2.2.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт. 2.

G1 — генератор тока высокой частоты; *Z1* — элемент связи контура с генератором; *LC1* — параллельный резонансный контур; *C2* — конденсатор связи; *K3* — короткозамыкающий проводник; *VD* — диод; *X1*, *X2* — контакты подключения диода или короткозамыкающего проводника; *Z2* — элемент развязки по переменному току; *G2* — генератор постоянного тока; *Z3* — элемент связи контура с усилителем; *A* — усилитель; *P* — измерительный прибор



Черт. 2

2.2.2. Генератор тока высокой частоты *G1* должен удовлетворять следующим требованиям:

- амплитуда не должна превышать 10 % значения постоянного тока;

- нестабильность амплитуды не должна выходить за пределы $\pm 1\%$.

2.2.3. Элементы связи *Z1* и *Z3* могут быть выполнены по любому типу связи, принятому в куметрах. Связь с генератором и усилителем должна быть такой, чтобы при настройке контура в резонанс в режимах калибровки и измерения изменения измерительного сигнала и потерь, вносимых в контур, не привели бы к увеличению погрешности измерений более чем на 1 %.

2.2.4. Значение индуктивности *L*, Гн, контура выбирают из условия

$$2\pi fL \gg r_{\text{диф}},$$

С. 4 ГОСТ 18986.14—85

где $r_{\text{диф}}$ — значение дифференциального (или динамического) сопротивления диода, Ом;
 f — частота измерения, Гц.

2.2.5. Колебательный контур $LC1$ должен обеспечивать возможность настройки на частоту генератора $G1$.

Погрешность определения добротности контура при коротком замыкании контактов $X1$ и $X2$ не должна выходить за пределы $\pm 7 \%$.

2.2.6. Если значение емкости конденсатора C_2 , Φ , выбирают из условия

$$C_2 = (0,9 - 1,1) \sqrt{\frac{C_k}{2\pi f r_{\text{диф}} Q_k}},$$

где C_k — полная емкость контура без диода при настройке его в резонанс на частоту измерения, Φ ;
 Q_k — добротность контура без диода,

то потери, вносимые в контур при подключении диода, составят 0,9—1,1 собственных потерь контура.

Емкость конденсатора $C2$ должна быть определена с погрешностью в пределах $\pm 2 \%$.

2.2.7. Полная емкость контура C_k должна быть определена с погрешностью в пределах $\pm 3 \%$.

2.2.8. Короткозамыкающий проводник должен иметь такую же геометрическую форму, как и выводы диода.

2.2.9. В качестве развязки $Z2$ по высокой частоте следует применять резистор или дроссель. Значение полного сопротивления элемента развязки Z_2 , Ом, должно быть выбрано из условия

$$Z_2 > 100r_{\text{диф}}.$$

2.2.10. Генератор постоянного тока $G2$ должен удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать установление и поддержание постоянного прямого тока через диод с погрешностью в пределах $\pm 3 \%$;

- нестабильность тока не должна выходить за пределы $\pm 1 \%$;

- коэффициент пульсации не должен выходить за пределы $\pm 1 \%$.

2.2.11. Усилитель A должен удовлетворять следующим требованиям:

- амплитудная характеристика должна быть линейной с погрешностью в пределах $\pm 2 \%$;

- усилитель должен иметь ступенчатую или плавную регулировку коэффициента усиления.

2.2.12. Погрешность измерительного прибора P не должна выходить за пределы $\pm 2 \%$.

2.3. Подготовка и проведение измерений

2.3.1. Подключают короткозамыкающий проводник к контактам $X1$ и $X2$.

2.3.2. Подают сигнал от генератора $G1$ и определяют значение добротности Q_k и общую емкость контура C_k в соответствии с методикой измерения параметров контуров на куметре.

2.3.3. Отсчитывают показание α_k прибора P в момент резонанса.

2.3.4. Заменяют короткозамыкающий проводник диодом, подают постоянный прямой ток заданного значения от генератора $G2$, настраивают контур в резонанс и отсчитывают показания α_d по прибору P .

2.3.5. Дифференциальное сопротивление диода $r_{\text{диф}}$, Ом, вычисляют по формуле

$$r_{\text{диф}} = \frac{C_k}{2\pi f C_2^2 Q_k} \left(\frac{1}{\alpha_d} - \frac{1}{\alpha_k} \right)$$

Если α_k соответствует полному отклонению шкалы прибора P , т. е. $\alpha_k = 1$, то расчет выполняют по формуле

$$r_{\text{диф}} = \frac{C_k}{2\pi f C_2^2 Q_k} \left(\frac{1}{\alpha_d} - 1 \right)$$

Допускается градуировку шкалы прибора P производить с помощью калибровочных резисторов, так как значения C_k , f , C_2 и Q_k постоянные для каждой конкретной измерительной установки.

2.4. Показатели точности измерений

2.4.1. Погрешность измерения дифференциального и динамического сопротивлений в процентах с доверительной вероятностью 0,997 не должна выходить за пределы $\pm (0,1 + \frac{0,025}{r_{\text{диф}}}) \cdot 100$, где $r_{\text{диф}}$ — значение дифференциального или динамического сопротивления диодов, указанное в стандартах или ТУ на диоды конкретных типов, Ом.

2.4.2. Расчет погрешности измерения приведен в приложении 2.

3. РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ

3.1. Принцип, условия и режим измерения

3.1.1. Метод основан на измерении общего сопротивления потерь последовательного резонансного контура, состоящего из дифференциального или динамического сопротивления диода и сопротивления собственных потерь контура.

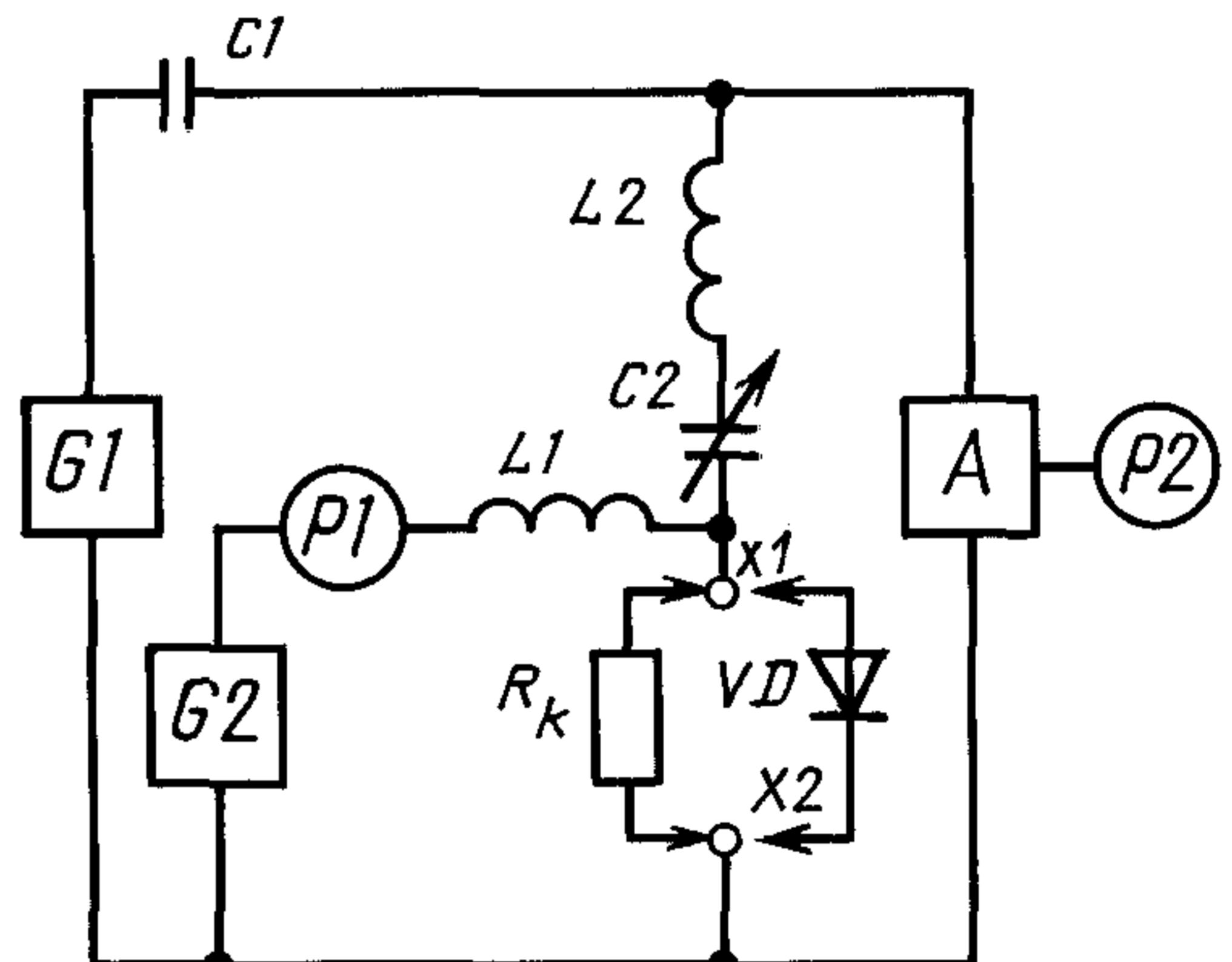
3.1.2. Условия и режим измерения должны соответствовать требованиям, изложенным в пп. 1.1.2 и 1.1.3.

3.2. Аппаратура

3.2.1. Измерение следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт. 3.

G1 — генератор тока высокой частоты; *G2* — генератор постоянного тока; *C1* — разделительный конденсатор; *L1* — индуктивность развязки по высокой частоте; *L2* — индуктивность контура; *C2* — переменный конденсатор; *R_k* — калибровочный резистор; *VD* — диод; *X1*, *X2* — контакты для подключения диода или калибровочного резистора; *A* — усилитель; *P1*, *P2* — измерительные приборы

Черт. 3



3.2.2. Генератор тока высокой частоты *G1* должен удовлетворять требованиям, изложенным в п. 2.2.2.

3.2.3. Генератор постоянного тока *G2* должен удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать установление и поддержание постоянного прямого тока через диод с погрешностью в пределах $\pm 3\%$;

- нестабильность постоянного тока не должна выходить за пределы $\pm 1\%$;

- коэффициент пульсации не должен выходить за пределы $\pm 1\%$.

3.2.4. Значение емкости *C₁*, Ф, выбирают из условия

$$\frac{1}{2\pi f C_1} > r_{\text{диф}} + r_{\text{п.к}} + r_{\text{конт}},$$

где $r_{\text{диф}}$ — значение дифференциального или динамического сопротивления диода, указанное в стандартах или ТУ на диоды конкретных типов, Ом;

$r_{\text{п.к}}$ — сопротивление потерь резонансного контура, Ом;

$r_{\text{конт}}$ — значение переходного сопротивления контактов подключения, Ом;

f — частота измерения, Гц.

3.2.5. Значение индуктивности *L₁*, Гн, выбирают из условия

$$2\pi f L_1 >> r_{\text{диф}} + r_{\text{конт}}.$$

3.2.6. Измерительный прибор *P1* должен обеспечивать измерение постоянного тока через диод с погрешностью в пределах $\pm 2\%$.

В электрической схеме допускается отсутствие прибора *P1*.

C. 6 ГОСТ 18986.14—85

3.2.7. Колебательный контур $L2C2$ должен обеспечивать возможность настройки на частоту измерения и иметь добротность $Q \geq 400$.

3.2.8. Значение сопротивления калибровочного резистора R_k , Ом, выбирают из условия

$$R_k = (1 - 2)r_{\text{диф}}.$$

Погрешность определения сопротивления R_k не должна выходить за пределы $\pm 1\%$.

3.2.9. Если значение переходного сопротивления контактов $X1$ и $X2$ меньше или равно $0,015 r_{\text{диф}}$, то его при измерениях не учитывают.

3.2.10. Усилитель A должен удовлетворять требованиям, изложенным в п. 2.2.11.

3.2.11. Погрешность измерительного прибора $P2$ не должна выходить за пределы $\pm 2\%$.

3.3. Подготовка и проведение измерений

3.3.1. Подключают калибровочный резистор R_k к контактам $X1$ и $X2$, подают переменный ток генератора $G1$ и настраивают контур в резонанс по минимальному показателю измерительного прибора $P2$. Показания прибора $P2$ пропорциональны значению R_k или $r_{\text{диф}}$, т. к. сопротивление потерь резонансного контура и контактов постоянны для каждой конкретной измерительной установки.

По известному значению сопротивления резистора R_k калибруют в омах шкалу прибора $P2$ путем изменения коэффициента усиления усилителя A .

3.3.2. Подключают диод к контактам $X1$ и $X2$, подают от генератора $G2$ на диод постоянный ток заданного значения, настраивают контур в резонанс и отсчитывают значение дифференциального или динамического сопротивления диода.

3.4. Показатели точности измерения

3.4.1. Погрешность измерения дифференциального и динамического сопротивлений диодов не должна выходить за пределы $\pm 10\%$ с доверительной вероятностью 0,997.

3.4.2. Расчет погрешности измерения приведен в приложении 2.

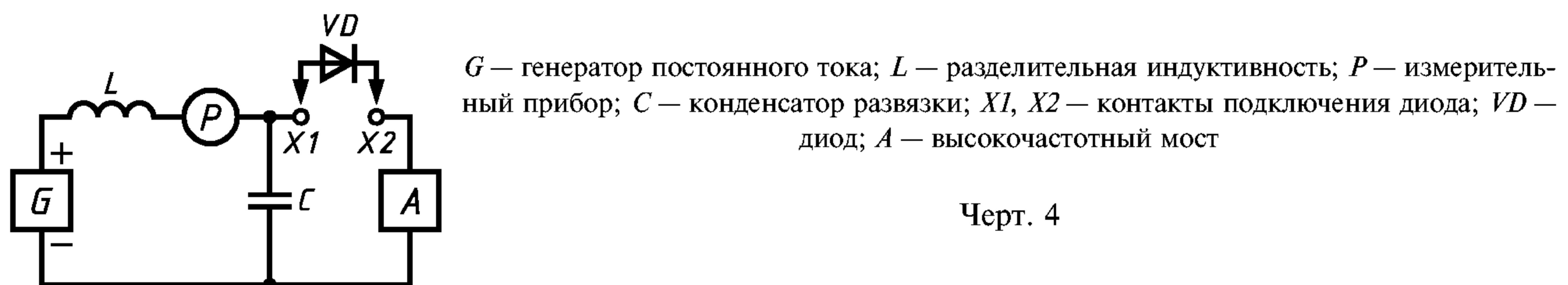
4. МОСТОВОЙ МЕТОД

4.1. Условия и режим измерения

4.1.1. Условия и режим измерения должны соответствовать требованиям, изложенным в пп. 1.1.2 и 1.1.3.

4.2. Аппаратура

4.2.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт. 4.



4.2.2. Генератор постоянного тока G должен удовлетворять следующим требованиям:

- установление и поддержание постоянного тока через диод с погрешностью в пределах $\pm 3\%$;
- нестабильность постоянного тока не должна выходить за пределы $\pm 1\%$;
- коэффициент пульсации не должен выходить за пределы $\pm 1\%$.

4.2.3. Индуктивность L служит для развязки по переменному току. Значения емкости C , Ф, и индуктивности L , Гн, выбирают из условий

$$2\pi fL \gg \frac{1}{2\pi fC}; \quad \frac{1}{2\pi fC} \ll r_{\text{диф}},$$

где $r_{\text{диф}}$ — значение дифференциального (или динамического) сопротивления диода, указанное в стандартах или ТУ на диоды конкретных типов, Ом.

4.2.4. Измерительный прибор P должен обеспечивать измерение постоянного тока диода с погрешностью в пределах $\pm 2 \%$.

4.2.5. Высокочастотный мост A должен удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать измерение на заданной частоте;
- обеспечивать прохождение постоянного тока между его выходными контактами;
- обеспечивать задание амплитуды переменного тока не более 10 % значения постоянного тока, проходящего через диод;
- погрешность измерения не должна выходить за пределы $\pm 5 \%$.

4.2.6. Переходное сопротивление контактов $X1$ и $X2$, емкость между ними и емкость между входными контактами измерительного моста при обработке результатов измерения не учитывают.

4.3. Подготовка и проведение измерений

4.3.1. Уравновешивают высокочастотный измерительный мост A согласно технической документации на него.

4.3.2. Подключают диод к контактам $X1$ и $X2$, устанавливают постоянный ток генератора G .

Уравновешивают мост и отсчитывают значения параллельного сопротивления R_{Π} и параллельной емкости C_{Π} .

Дифференциальное (или динамическое) сопротивление диода $r_{\text{диф}}$, Ом, вычисляют по формуле

$$r_{\text{диф}} = \frac{R_{\Pi}}{1 + (2 \pi f R_{\Pi} C_{\Pi})^2}.$$

4.4. Показатели точности измерения

4.4.1. Погрешность измерения дифференциального и динамического сопротивлений диода не должна выходить за пределы $\pm 10 \%$ с доверительной вероятностью 0,997.

4.4.2. Расчет погрешности измерения приведен в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 *Справочное*

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 18986.14—85 СТ СЭВ 2769—80

Разд. 3 и 4 ГОСТ 18986.14—85 соответствуют разд. 6 СТ СЭВ 2769—80.

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Метод замещения

1.1. Дифференциальное сопротивление диода $r_{\text{диф}}$, Ом, определяют по формуле

$$r_{\text{диф}} = r_k \frac{\alpha_d}{\alpha_k}.$$

1.2. Интервал, в котором с доверительной вероятностью находится погрешность измерений $\delta r_{\text{диф}}$, %, определяют по формуле

$$\begin{aligned} \delta r_{\text{диф}} &= \pm K_\Sigma \sqrt{\left(\frac{\delta r_k}{K_1}\right)^2 + \left(\frac{\delta \alpha_k}{K_2}\right)^2 + \left(\frac{\delta \alpha_d}{K_3}\right)^2} = \pm K_\Sigma \sqrt{\left(\frac{\delta r_k}{K_1}\right)^2 + \left(\frac{\delta A}{K_4}\right)^2 + \left(\frac{\delta R_{\text{вх}}}{K_5}\right)^2 + \left(\frac{\delta R_{\text{вых}}}{K_6}\right)^2 + \left(\frac{\delta P}{K_7}\right)^2 + \left(\frac{\delta A}{K_4}\right)^2 + \\ &\quad + \left(\frac{\delta B}{K_8}\right)^2 + \left(\frac{\delta R_{\text{вх}}}{K_5}\right)^2 + \left(\frac{\delta R_{\text{вых}}}{K_6}\right)^2 + \left(\frac{\delta P}{K_7}\right)^2 + \left(\frac{\delta U}{K_9}\right)^2} = \\ &= \pm K_\Sigma \sqrt{\left(\frac{\delta r_k}{K_1}\right)^2 + 2\left(\frac{\delta A}{K_4}\right)^2 + 2\left(\frac{\delta R_{\text{вх}}}{K_5}\right)^2 + 2\left(\frac{\delta R_{\text{вых}}}{K_6}\right)^2 + 2\left(\frac{\delta P}{K_7}\right)^2 + \left(\frac{\delta B}{K_8}\right)^2 + \left(\frac{\delta U}{K_9}\right)^2}, \end{aligned}$$

где $K_\Sigma, K_1 \dots K_9$ — коэффициенты, зависящие от законов распределения суммарной и частных погрешностей соответственно;

δr_k — составляющая погрешности определения сопротивления резистора калибровки;

$\delta \alpha_k$ — составляющая погрешности отсчета по шкале измерительного прибора при подключении резистора калибровки;

$\delta \alpha_d$ — составляющая погрешности отсчета по шкале измерительного прибора при подключении диода;

δA — составляющая погрешности за счет нестабильности амплитуды переменного тока;

$\delta R_{\text{вх}}$ — составляющая погрешности за счет шунтирующего влияния входного сопротивления усилителя;

$\delta R_{\text{вых}}$ — составляющая погрешности за счет шунтирующего влияния выходного сопротивления генератора;

δP — составляющая погрешности за счет неточности показаний измерительного прибора;

δB — составляющая погрешности за счет нелинейности усиления амплитуды переменного тока;

δU — составляющая погрешности за счет пульсации постоянного напряжения.

1.3. Так как суммарная погрешность измерения зависит от многих влияющих факторов и складывается из большого числа частных составляющих погрешности, принимаем распределение составляющих погрешности измерения и распределение суммарной погрешности измерения нормальным. Тогда при доверительной вероятности 0,997 коэффициенты K_i и K_Σ равны 3. Подставляя в формулу (см. п. 1.2) значения $\delta r_k = 0,5 \%$, $\delta A = 1 \%$, $\delta R_{\text{вх}} = 1 \%$, $\delta R_{\text{вых}} = 1 \%$, $\delta P = 3 \%$, $\delta B = 2 \%$, $\delta U = 2 \%$, получаем, что погрешность измерения не должна выходить за пределы $\pm 7 \%$ с доверительной вероятностью 0,997.

2. Резонансный метод с параллельным контуром

2.1. Сопротивление диодов $r_{\text{диф}}$, Ом, определяют по формуле

$$r_{\text{диф}} = \frac{C_k}{2 \pi f C_2^2 Q_k} \left(\frac{1}{\alpha_d} - \frac{1}{\alpha_k} \right).$$

2.2. Интервал, в котором с доверительной вероятностью находится погрешность измерений $\delta r_{\text{диф}}$, %, определяют по формуле

$$\delta r_{\text{диф}} = \pm \sqrt{\left(\frac{r_{\text{конт}}}{r_{\Delta}} + K_{\Sigma} \sqrt{\left(\frac{\delta C_{\text{K}}}{K_1} \right)^2 + \left(\frac{\delta f}{K_2} \right)^2 + 2 \left(\frac{\delta C_2}{K_3} \right)^2 + \left(\frac{\delta Q_{\text{K}}}{K_4} \right)^2 + \left(\frac{\delta \alpha_{\Delta}}{K_5} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\alpha_{\Delta}}{\alpha_{\text{K}}}} \right)^2 + \left(\frac{\delta \alpha_{\text{K}}}{K_6} \cdot \frac{1}{\frac{\alpha_{\text{K}}}{\alpha_{\Delta}} - 1} \right)^2} \right)},$$

при этом $\delta \alpha_{\Delta}$ и $\delta \alpha_{\text{K}}$ определяют по формулам:

$$\delta \alpha_{\Delta} = \pm K'_{\Sigma} \sqrt{\left(\frac{\delta A}{K_7} \right)^2 + \left(\frac{\delta P}{K_8} \right)^2 + \left(\frac{\delta U}{K_9} \right)^2};$$

$$\delta \alpha_{\text{K}} = \pm K''_{\Sigma} \sqrt{\left(\frac{\delta A}{K_7} \right)^2 + \left(\frac{\delta C_{\text{K}}}{K_1} \right)^2 + \left(\frac{\delta P}{K_8} \right)^2},$$

где K_{Σ} , K'_{Σ} , K''_{Σ} , $K_1 \dots K_9$ — коэффициенты, зависящие от законов распределения суммарных и частных погрешностей соответственно;

δC_{K} — составляющая погрешности определения емкости калибровочного конденсатора;

δf — составляющая погрешности за счет нестабильности частоты генератора;

δC_2 — составляющая погрешности определения общей емкости контура;

δQ_{K} — составляющая погрешности определения добротности контура;

δA — составляющая погрешности за счет нестабильности амплитуды переменного тока;

δP — составляющая погрешности отсчета показаний измерительного прибора;

δU — составляющая погрешности за счет пульсации постоянного напряжения.

2.3. Так как суммарная погрешность измерения зависит от многих влияющих факторов и складывается из большого числа частных составляющих погрешности, принимаем распределение составляющих погрешности измерения и распределение суммарной погрешности измерения нормальным. Тогда при доверительной вероятности $P = 0,997$ коэффициенты K_i и K_{Σ} равны 3. Подставляя в формулу значения $\delta C_{\text{K}} = 3\%$, $\delta C_2 = 2\%$, $\delta Q_{\text{K}} = 7\%$, $\delta A = 1\%$, $\delta P = 2\%$, $\delta B = 2\%$, $\delta U = 2\%$, получаем, что погрешность измерения $\delta r_{\text{диф}}$, %, с доверительной вероятностью $P = 0,997$ не должна выходить за пределы, рассчитанные по формуле

$$\delta r_{\text{диф}} = \pm \left(\frac{0,025}{r_{\text{диф}}} + 0,1 \right) \cdot 100.$$

3. Резонансный метод с последовательным контуром

3.1. Интервал, в котором с доверительной вероятностью находится погрешность измерений, определяют по методике, изложенной в разд. 1 настоящего приложения, при условии соблюдения требований пп. 3.2.4, 3.2.5.

4. Мостовой метод

4.1. Интервал, в котором с доверительной вероятностью находится погрешность измерений, $\delta r_{\text{диф}}$, %, определяют по формуле

$$\delta r_{\text{диф}} = \pm K_{\Sigma} \sqrt{\left(\frac{\delta A}{K_1} \right)^2 + \left(\frac{\delta Z_C}{K_2} \right)^2 + \left(\frac{\delta Z_L}{K_3} \right)^2 + \left(\frac{\delta U}{K_4} \right)^2 + \left(\frac{\delta \alpha_{\text{опер}}}{K_5} \right)^2},$$

где K_{Σ} , $K_1 \dots K_5$ — коэффициенты, зависящие от законов распределения составляющих погрешностей соответственно;

δA — составляющая погрешности измерительного моста;

δZ_C , δZ_L — составляющие погрешности за счет шунтирующего влияния конденсатора и разделительной индуктивности соответственно;

δU — составляющая погрешности за счет неточности установления и поддержания постоянного напряжения;

$\delta \alpha_{\text{опер}}$ — составляющая погрешности за счет неточности отсчета момента равновесия моста.

4.2. Так как суммарная погрешность измерения зависит от многих влияющих факторов и складывается из большого числа частных составляющих погрешности, принимаем распределение составляющих погрешности измерения и распределение суммарной погрешности измерения нормальным. Тогда при доверительной вероятности 0,997 коэффициенты K_i и K_{Σ} равны 3. Подставляя в формулу значения $\delta A = 5\%$, $\delta Z_C = 1\%$, $\delta Z_L = 1\%$; $\delta U = 2\%$, $\delta \alpha_{\text{опер}} = 2\%$, получаем, что погрешность измерения не должна выходить за пределы $\pm 10\%$ с доверительной вероятностью 0,997.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Н.Л. Рыбако*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 31.05.2004. Подписано в печать 18.06.2004. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд.л. 1,05.
Тираж 80 экз. С2656. Зак. 212.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов